

DIN EN 61300-3-35:2010-08 (D)

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen - Visuelle und automatisierte Inspektion der Endflächen von Lichtwellenleiter-Steckverbindern (IEC 61300-3-35:2009); Deutsche Fassung EN 61300-3-35:2010

Inhalt

Seite

Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Messverfahren	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Messbedingungen	5
3.3 Vorbehandlung	5
3.4 Erholung	5
4 Prüfvorrichtung	5
4.1 Methode A: unmittelbare Betrachtung durch ein optisches Mikroskop	5
4.2 Methode B: Videomikroskopie	5
4.3 Methode C: Videomikroskopie mit automatisierter softwaregestützter Auswertung	5
4.4 Anforderungen an die Kalibrierung der Systeme mit niedriger und hoher Auflösung	6
5 Verfahren	6
5.1 Messbereiche	6
5.2 Kalibrierverfahren	7
5.3 Prüfablauf	7
5.4 Visuelle Anforderungen	9
Anhang A (informativ) Beispiele von untersuchten Endflächen mit Defekten	11
Anhang B (normativ) Kalibrierartefakt und Verfahren zur Herstellung	17
B.1 Artefakt für ein hochauflösendes System	17
B.2 Artefakt für ein System mit niedriger Auflösung	19
Literaturhinweise	20

Bilder

Bild 1 – Prüfablaufplan	8
-------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 – Messungsbereiche für Einfaser-Steckverbinder	6
Tabelle 2 – Messungsbereiche für Mehrfaser-Rechtecksteckverbinder mit Stift	7
Tabelle 3 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Einmodenfaser, $RL \geq 45$ dB	9
Tabelle 4 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit Schräg-Politur (APC), Einmodenfaser	9
Tabelle 5 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Einmodenfaser, $RL \geq 26$ dB	10
Tabelle 6 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Mehrmodenfaser,	10